第九條附表四 半導體或面板產業製程技術項目應符合之 最佳可行技術

半導體業或面板產業之能源用戶,應符合下列相同行業「最佳可行技術」所列示能源效率相關製程技術項目之內容及效率值。

一、半導體產業製程技術項目應符合之最佳可行技術

半導體產業製程技術項目最佳可行技術

(一) |機台系統節能設計:

就系統面(如真空泵(vacuum pump)、尾氣處理設備(local scrubber)、冷卻器(chiller)、加熱器(heater)、排氣(exhaust)、壓縮乾燥空氣(CDA)、超純水(ultrapure water)、氣體供應設備等)提出機台系統端相關之節能設計方案(如:壓損、管徑設計、溫差、尾氣處理使用節能智慧控制等),或高能源效率機台選用之說明。

(二) 採用高效率機台元件:

機台元件採用高能效產品或符合國際最新節能設施規範;相關元件節能項目可參考下列範例:

- 1. 高功率 (單項或總合計)或長時數運轉之馬達選用高能效產品 (如CNS 14400 IE3 等級以上)。
- 電氣設施採變頻控制(如泵浦加裝變頻裝置或節能調節器等)。
- 3. 高效率射頻產生器(RF Generator)(電源供應器規格容量匹配 射頻產生器之負載,避免過大設計)。
- 4. UPS具有節能模式之控制功能。
- 5. 高效率熱轉換器(如低壓損、大溫差)。
- 6. 於製程許可下選用節能產品,或提供機台相關節能證明(符合或優於近三年之最新能效標準)。

(三)機台資源調控設計:

- 1. 主機台與附屬設備之選用,考量採具備節省能源之硬體與控制設計,如各類節能設計、待機模式等。
- 2. 製程通用(utility)系統節能最適化:如排氣、冷卻、壓縮空氣、惰性氣體(如氮氣)等之用量調控設計與管理機制。

(四) 能源管理系統:

1. 對於大型耗電、耗熱公用設備,如風機(kW/CMM)、冰水主機、空調箱與冷卻水塔(kW/RT)、水泵浦(kW/CMM)、空壓機(kW/CMM)等,建立設備用電能效的能源基線,並持續即時監控其用電能效及異常管理,以利於設備保養維護或汰

舊換新,維持設備在高能效運轉狀態;或可參照如SEMI S23 標準之精神量測估算相關重要耗能設備之能耗值,建立廠區 能耗基線,並說明相關節能規劃。相關設備項目可參考下表:

| (1) Exhaust | (6) Water cooled by cooling-tower | |
|--|--------------------------------------|------------------------|
| (2) Vacuum | (7) UPW or DIW (Temp. < 25°C) | |
| (3) CDA | (8) Hot UPW or DIW (Temp. > 85 °C) | |
| (4) High pressure CDA | (9) Heat load | Heat removal via air |
| (827~1034 kPa gauge) | | Heat removal via water |
| (5) Water cooled by refrigeration ($\Delta T = 5$ °C) | $(10)N_2$ | |

2. 利用能源管理系統區分管理各類能源耗用占比及節能情形。

(五) 製程技術能源使用強度:

6 吋以下、8 吋產品之製程技術,須符合前 10% (Top 10) 能源使用強度標竿值,如下表:

單位:度電/矽晶圓面積-平方公分

| | 6 吋以下 註1 | 8 叶 |
|----|----------|------|
| 能源 | 0.45 | 0.60 |
| 使用 | 0.47 | 0.69 |
| 強度 | | |

註1:適用6吋平均光罩層數 (mask layer) 14 以下者。

註2:適用8吋平均光罩層數 (mask layer) 15 以下者。

註 3:6 吋平均光罩層數超過 14 層、8 吋平均光罩層數超過 15 層者,或因 法規限制、專利權保護、國際貿易障礙或其他不可歸責於申請人等因 素,致不能符合者,經提出資料佐證,不受其限制。

註 4:能源使用強度計算公式:

能源使用強度= 全廠單一尺寸相同製程之年電力使用量(度電) 單一尺寸相同製程之矽晶圓年產出面積(平方公分)

前述單一尺寸相同製程之矽晶圓年產出面積,計算式為: $\pi \times r^2 \times$ 矽晶圓產出片數(片),其中 π 為 $3.1415926 \times r$ 為矽晶圓半徑(公分)。

二、面板產業製程技術項目應符合之最佳可行技術

面板產業製程技術項目最佳可行技術

- (一) 機台附屬設備之選用:
 - 1. 儘可能評估其能源效率。
 - 2. 採用高能源效率或變頻控制(如機台所使用之泵浦須加裝變 頻裝置或是節能調節器等)。

(二) 節能設計:

機台設備應符合下列項目:

- 1. 具備節省能資源考量之待機模式 (Idle mode)者,或具備其他能達到相同功效之節能模式設計。
- 具備自動或手動控制之相對應軟體,以進行如真空泵、烤箱 等耗能附屬設備待機模式下之節能控制。

(三) 製程技術能源使用強度:

5 代廠以下、5.5 代廠至 8 代廠以下之製程技術,須符合前 10% (Top 10) 能源使用強度標竿值,如下表:

單位:度電/投入基板面積-平方公尺

| | 5代廠以下註1 | 5.5 代廠至8 代廠以下註1 |
|--------|---------|-----------------|
| 能源使用強度 | 148 | 110 |

註 1:適用非晶性 (amorphous) LCD 5 道以下光罩之製程且薄膜電晶體元件陣列 (TFT-Array) 基板及彩色濾光片 (Color filter,簡稱 CF)實際月投片量兩者均達 120K (千片)以上。

註 2:因法規限制、專利權保護、國際貿易障礙或其他不可歸責於申請人等因素,致不能符合者,經提出資料佐證,不受其限制。

註3:能源使用強度計算公式:

能源使用強度 = 全廠相同世代製程之年電力使用量(度電)

相同世代玻璃基板年投入面積(平方公尺)

前述相同世代玻璃基板年投入面積,指各尺寸基板及彩色濾光片面積(平方公尺/片)×各尺寸基板投入片數(片)。